

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55 °C ~ 85 °C (注1)	保存温度範囲	-10 °C ~ 60 °C (注2)	
	電 圧	AC 200 V	使用湿度範囲	相対湿度 85%以下	
	電 流	1 A	保存湿度範囲	(但し結露の無いこと)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) 以下で測定する。	15 mΩ以下	○	-
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	1000MΩ以上	○	-
	耐電圧	AC 650Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	-
機 械 的 性 能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗：15mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐振性	周波数 10~55 Hz、片振幅 0.75 mmで 1 サイクル 5 分間 3 軸方向 各 10 サイクル試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸方向各 3 時間試験する。		○	-
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2°C、湿度 90~95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗：15 mΩ以下 ② 絶縁抵抗：1000 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	温度サイクル	温度 -55 → +125°C 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 (槽の移し替え時間は2~3分)		○	-
	耐熱性	温度 85 °C中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗：15 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐寒性	温度 -55 °C中に 96 時間放置する。		○	-
	二酸化硫黄	濃度 25 ppm、25±2 °C 75±5%RH 96 時間放置する。 (試験規格：JIS C 60068)	① 接触抵抗：15 mΩ以下 ② コネクタ機能を損なうような腐食がないこと。	○	-
	塩水噴霧	濃度5%の塩水、48時間放置する	コネクタ機能を損なうような腐食がないこと。	○	-
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合：はんだ温度 260±5°C 浸せき時間 10±1秒間	外観の変形及び端子などに著しい ガタのないこと。	○	-
はんだごての場合：こて温度 360°C はんだ付け時間 5秒以内		○		-	
はんだ付け性	はんだ温度 245±3°C、浸せき時間 2 秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	-	
△の数					
訂正記事		設計		検図	
年月日					
備考			承認	HT. YAMAGUCHI	20181210
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検 図	HT. YAMAGUCHI	20181210
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			担 当	HR. NAGAYASU	20181207
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。			製 図	TS. HORI	20181207
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番 SLC-386226-00-00		
HRS	製品規格表		製品名		HIF3M*W-*PA-2.54DSA(63)
	ヒロセ電機株式会社		製品コード		
					△ 1/1